

Búsqueda de Patentes

Introducción

Profa. Fabíola Wüst Zibetti

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y
redacción de patentes”

Medellín, Colombia

22 de noviembre de 2009

Contenido

1. Importancia de las bases de patentes
2. Objetivos de la búsqueda
3. Limitaciones de las búsquedas
4. Tipos de búsquedas
5. Criterios de búsqueda
6. Interpretación de los resultados de búsquedas

1. Importancia de las bases de patentes

Información tecnológica

Cantidad

- Cerca de 100 millones de documentos de diversos países
- Crecimiento mundial de 1,5 millones de documentos de patentes al año

Cualidad

- Alcanza todos los campos tecnológicos
- Información más reciente en relación al estado de la técnica
- 70% a 80% de la tecnología tiene divulgación exclusiva por patentes
- Documentos en formato normalizado

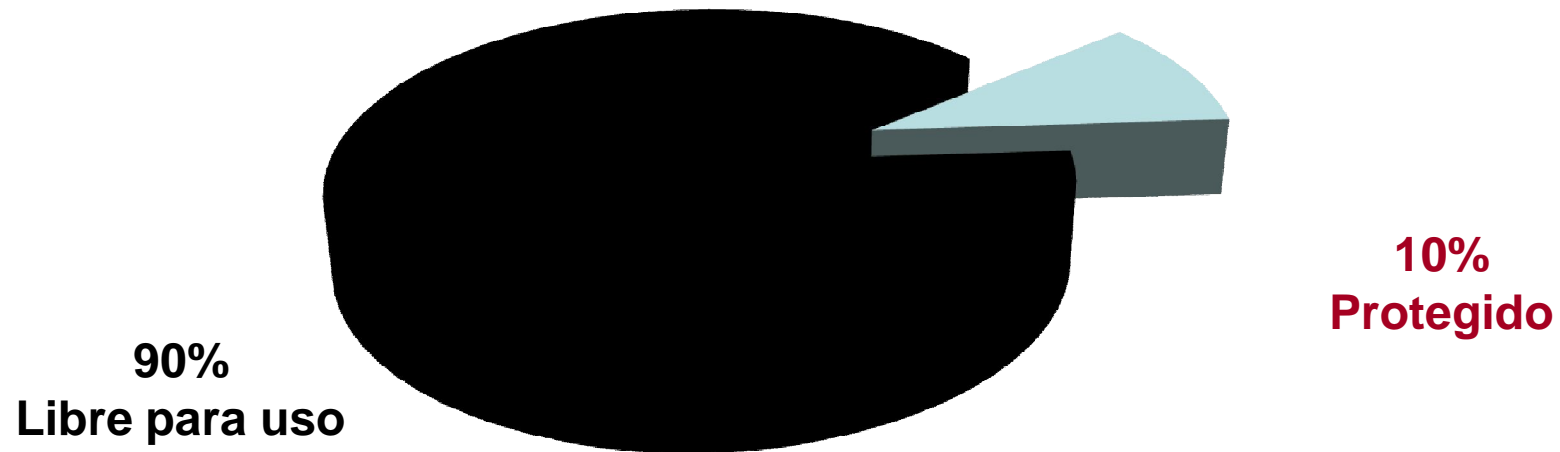
Acceso

- Colecciones de documentos completos centralizadas
- Oficinas nacionales o regionales
- Medio electrónico
- Mecanismos y criterios objetivos de búsqueda



1. Importancia de las bases de patentes

Soluciones encontradas en documentos de patentes

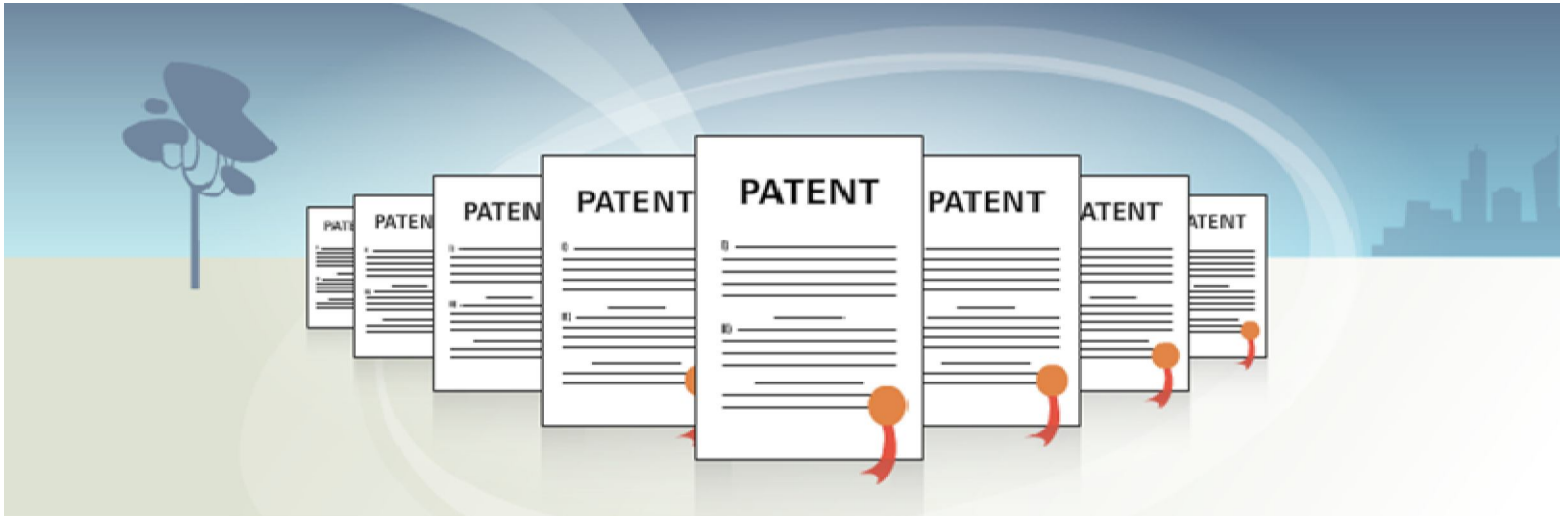


La patente sólo está protegida en el país que ha sido concedida.
En los demás países es de dominio público.

1. Importancia de las bases de patentes

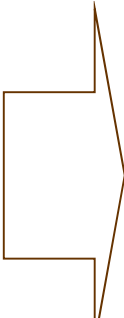
Importancia

- Tecnológica
- Legal (jurídica)
- Comercial



1. Importancia de las bases de patentes

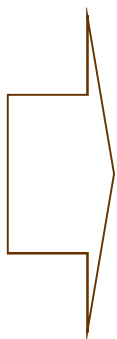
Tecnológica

- Conocer el estado de la técnica
 - Identificar problemas y soluciones técnicas
 - Conocer la evolución tecnológica
 - Detectar nuevas tecnologías
 - Identificar nuevos usos de la tecnología
 - Usar como base en investigación y desarrollo (I&D)
 - Identificar tecnologías de uso libre
- 
- No duplicar esfuerzos en investigaciones
 - Evitar incurrir en gastos innecesarios
 - Mejorar un producto o proceso existente
 - Determinar la patentabilidad de sus invenciones
 - Analizar las tendencias de la tecnología
 - Evaluar la edad de las tecnologías

1. Importancia de las bases de patentes

Legal (jurídica)

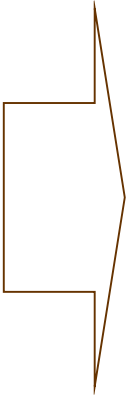
- Conocer las tecnologías protegidas por patente
- Conocer titulares de los derechos
- Evaluar la patentabilidad propia de las invenciones
- Evaluar la posibilidad de obtener patente en el extranjero



- Conferir seguridad jurídica respecto a las actividades que pueden emprender
- Evitar posibles infracciones
- Hacer oposición a la concesión de otras patentes
- Negociar licencias y transferencia de tecnología

1. Importancia de las bases de patentes

Comercial

- Identificar los detentores de tecnologías en distintos sectores
 - Conocer las tecnologías protegidas de los competidores
 - Identificar inventores
 - Identificar tecnologías, nichos o segmentos de mercado
- 
- Vigilar y monitorear la competencia
 - Identificar posibles socios comerciales
 - Encontrar nuevos proveedores de tecnología
 - Rastrear capacitación tecnológica
 - Evaluar el ciclo de vida de un producto
 - Valorar la tecnología
 - Realizar estudios de tendencia
 - Explotar tecnologías de patentes que no han sido concedidas, no son válidas en ciertos países o que han perdido su vigencia

1. Importancia de las bases de patentes

Potenciales interesados en las informaciones de las bases de patentes

Inventores

Investigadores

Gestores de proyectos I&D

Industriales

Importadores/exportadores

Abogados y agentes PI

Estado



Actitudes

Pasiva

ignorar; no participar

Reactiva

combatir

Preactiva

prepararse

Proactiva

hacer

2. Objetivos de la búsqueda de patentes

Algunos objetivos de la búsqueda de patentes

- 2.1 Definir el estado de la técnica
- 2.2 Mapear la evolución de tecnologías
- 2.3 Identificar nuevos mercados
- 2.4 Identificar tecnologías emergentes
- 2.5 Rastrear capacitación tecnológica
- 2.6 Monitorear competidores
- 2.7 Identificar fuentes licenciamiento y transferencia tecnología

2.1 Definir el estado de la técnica

- Permite conocer los antecedentes de la invención que se reivindica
- Posibilita encontrar referencias relacionadas con la invención, para determinar su patentabilidad
- Puede determinar qué posibilidades tiene de obtener una cobertura amplia
- Permite verificar la necesidad de modificación de las reivindicaciones
- Es factor clave para decidir si presentar o no una solicitud de patente

Búsqueda del estado de la técnica para presentar una solicitud de patente:

- No es obligatoria al inventor o agente
- El examinador la hace para determinar su patentabilidad

2.1 Definir el estado de la técnica

Recomendaciones

Establecer las características esenciales de la invención que se reivindica

- Problema que resuelve
- Tipo de solución encontrada al problema
- Utilidad o aplicación industrial de la invención
- Efectos técnicos de la invención
- Forma de elaboración de la invención
- Materiales o métodos utilizado en la confección de la invención

Esas características han de resumirse en palabras u oraciones esenciales con las que se podrá emprender una búsqueda en las bases de patentes

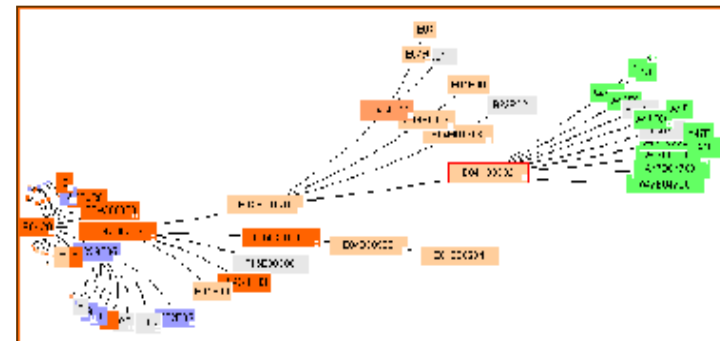
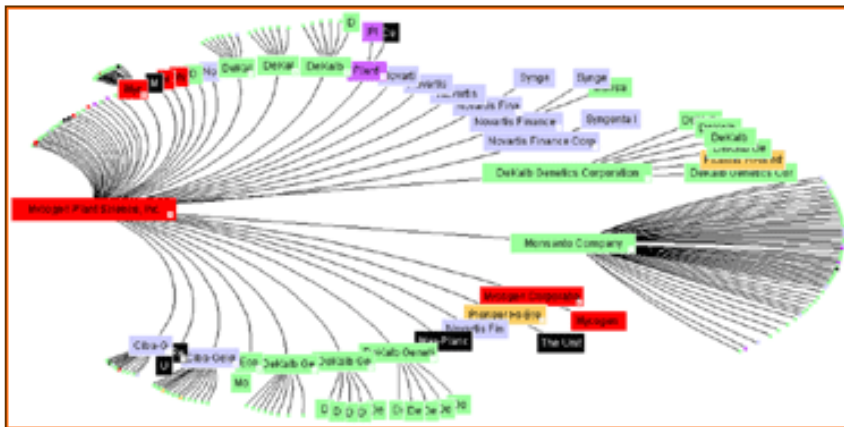
2.2 Mapear la evolución de tecnologías

Puede hacerse por el análisis de las tecnologías de determinado segmento

Puede hacerse por el rastreo de determinada tecnología

Recomendaciones

- Analizar las referencias en documentos de segmentos específicos y su relación (clases, grupos, subgrupos)
- Mapear las citaciones en los documentos de patentes



2.3 Identificar nuevos mercados

Puede hacerse la revisión de nuevos mercados y/o de mercados emergentes

Recomendación

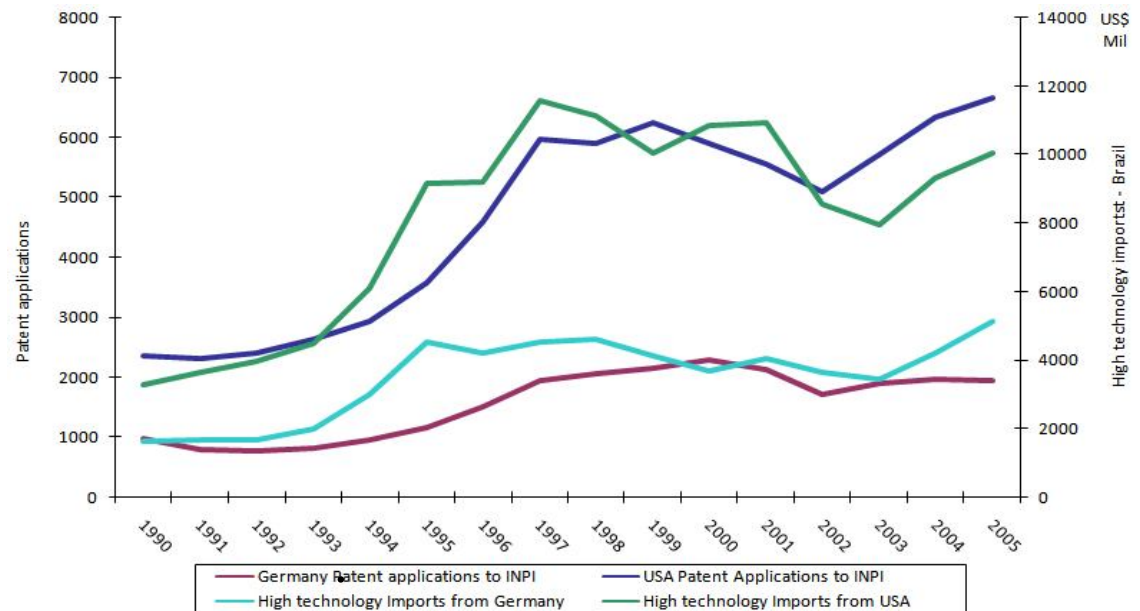
- Identificar destinos elegidos para protección de tecnologías por sectores o en general
- Evaluar crecimiento del número de solicitudes de patentes en los países

Gráfico – Solicitudes de patente de no residentes e importaciones de bienes de alta tecnología:

País receptor: Brasil

Países de origen: Estados Unidos y Alemania

Fuente: Seabra, Zibetti y Nogueira, 2008.



2.4 Identificar tecnologías emergentes

Puede identificarse tecnologías emergentes y nuevas tecnologías

Recomendación

- Análisis de las actualizaciones en la Clasificación Internacional de Patentes y en las clasificaciones nacionales o regionales

Otros objetivos

- Posibilita el mapeo de áreas de mayor o menor desarrollo tecnológico
- Permite definir nuevos y potenciales caminos para el perfeccionamiento de productos y procesos

2.5 Rastrear capacitación tecnológica

Puede hacerse el rastreo de capacitación tecnológica nacional, regional y/o internacional

Recomendación

- Evaluación por distribución de patentes según:
 - Inventor
 - Empresa
 - Centros de I&D
 - País o provincia (p.ej. Estado Unidos)



Los datos permiten identificar

- Lugares o regiones donde se encuentran más o menos profesionales capacitados en I&D
- Personas capacitadas en actividades de I&D
- Instituciones involucradas en I&D
- Profesionales (abogados, agentes PI) con actividad en el área de protección de tecnologías

2.6 Monitorear competidores

Puede hacerse el monitoreo de los competidores en el ámbito nacional, regional y/o internacional

Recomendación

- Evaluación de la cantidad de solicitudes y patentes concedidas por
 - Empresa
 - Inventores (empleados)
 - Segmento y/o tipo de tecnología

Los datos permiten

- Determinar los campos técnicos de mayor actividad de una empresa en términos de patentes
- Evidenciar los puntos fuertes y débiles de una empresa, según su actividad en materia de patentes
- Identificar los (posibles) campos de interés de las empresas (potencialmente) competidoras

2.7 Identificar fuentes de licenciamiento y transferencia tecnología



Puede identificarse fuentes para el licenciamiento y transferencia de tecnología

Recomendación

- Identificar los titulares de patentes
- Búsqueda de los solicitantes de las patentes elegidas
- En Estados Unidos se busca por el “assignee”
- Consultar la oficina o las publicaciones relativas a la patente para saber si ha sido transferida a terceros

3. Limitaciones de las búsquedas

Plazo de sigilo de las solicitudes de patentes (en media 18 meses)

Limitaciones de las bases de patentes

- Cobertura geográfica
- Cobertura temática
- Cobertura temporal
- Secciones
- Opciones y criterios de búsqueda
- Tipos de documentos
- Forma de disposición de la información
- Actualización
- Idioma



3. Limitaciones de las búsquedas

Tipo de Archivo	Busca (1)	Numérico	Microforma	CD-ROM(2)
	Período	Período	Período	Período
Australia	a partir de 1980	-	-	-
Brasil	a partir de 1924	a partir de 1982	1924 - 1974	-
Canadá	a partir de 1980	-	-	-
Espana	-	-	1984 - 1994 (3)	a partir de 1990
Estados Unidos	a partir de 1969	1911 - 1966	1950 - 1982	a partir de 1992
Francia	a partir de 1972	1910 - 1948	1947-1972,1988-1994	a partir de 1992
Reino Unido	a partir de 1939	1950 - 1967	1936 - 1955	-
Holanda (4)	1982 - 1988	-	-	-
Japón (5)	-	-	-	a partir de 1976
OAPI (a)	-	-	-	1994
EPO (a)	a partir de 1978	-	-	a partir de 1978
OMPI (PCT) (a)	1978 - 1993	-	-	a partir de 1978
Alemania	a partir de 1972	-	1969 - 1972	-
Suiza	1961 - 1989	1920 - 1969	1988 - 1994	a partir de 1992
Unión Soviética	-	-	1957-1964, 1990	-
Alemania Oriental	1966 - 1974	-	-	

4. Tipos de búsquedas

4.1 Búsqueda Manual

4.2 Búsqueda en CD-Rom

4.3 Búsqueda en bases electrónicas de patente

4.4 Servicios de Búsqueda



4.2 Búsqueda en CD-Rom

Oficinas ofrecen CD-ROM-mensual y/o DVD-anual con informaciones bibliográficas y resumen de documentos de patente

Ejemplos

- Oficina Europea de Patentes

Espace Access solicitudes depositadas en EPO y bajo PCT a partir de 1978

- USPTO

Custom data extract Inventor CD-ROM

PATSIC-CONAME custom extract CD-ROM

- OMPI - PATENTSCOPE®

Datos del PCT publicados cada semana en DVD

Datos de texto completo del PCT desde 1978



4.3 Busca en bases electrónicas de patente

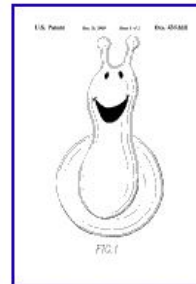
- Bases Comerciales de Patentes
- Bases Gratuitas de Patentes
- Bases de patentes sectoriales
- Google Patent
- Otras bases

 [Advanced Patent Search](#)

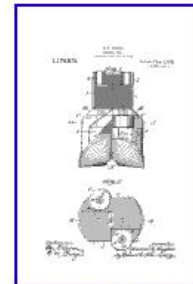
Search over 7 million patents.



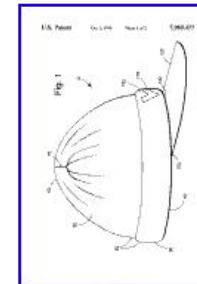
[MERRY-GO-ROUND](#)



[Jumping snail](#)



[REAMING DRILL](#)



[Hat with folded rim and visor](#)



[Zipper](#)

4.3 Busca en bases electrónicas comerciales

Algunas bases de datos de patente comerciales

Derwent: <http://thomsonreuters.com/>

Delphion: www.delphion.com

Dialog: <http://www.dialog.com>

Micropatent: <http://www.micropatent.com>

PatentCafe: <http://www.patentcafe.com>

Questel: <http://www.questel.com>

STN: <http://www.stn-international.de/>

WipsGlobal: <http://www.wipsglobal.com>



Derwent Innovations IndexSM

4.3 Busca en bases electrónicas de patente

Algunas bases gratuitas

Muchas oficinas de patentes nacionales y regionales permiten acceder gratuitamente en línea a sus propias bases, tales como:

Alemania	https://dpinfo.dpma.de/index_e.html
América latina	http://lp.espacenet.com/
Australia	http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.htm
Brasil	http://www.inpi.gov.br/
Colombia	http://www.sic.gov.br
España	http://invenes.oepm.es
Estados Unidos	http://www.uspto.gov/patft/index.html
Francia	http://www.plutarque.com
India	http://www.pfc.org.in/db/db.htm
Japón	http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
Oficina Europea Patentes	http://www.espacenet.com

4.3 Busca en bases electrónicas gratuitas

PatentScope®

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

- Acceso gratuito en línea a todas las solicitudes internacionales de patentes presentadas en el marco del PCT y los documentos conexos

Sitio: <http://www.wipo.int/patentscope/en/>



4.3 Búsqueda en bases sectoriales

Biotecnología

- EMBL: <http://www.embl-heidelberg.de>
Información en materia de nucleótidos, proteínas, estructuras macromoleculares tridimensionales, así como bases de datos para expresiones de genes.
- NCBI: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
Información sobre nucleótidos, estructuras, proteínas, taxonimias, así como una base de datos con información sobre secuencias de nucléotidos y aminoácidos
- Biochem: <http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/pdbsum/>
Estructura tridimensionales de aminoácidos

4.3 Otras bases

Conocimientos tradicionales

- Nuffic/CIRAN International Indigenous Knowledge Network: <http://www.nuffic.nl/ciran/ik.html>
- Phytochemical Society of North America's: <http://www.fin.edu/orgs/psna/links.html>
- Tropical Diseases Webring: http://pc4.sisc.ucl.ac.be/prelude/prelude_HomePage.html
- Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and Institutions (SRISTI): <http://csf.Colorado.EDU/sristi>
- World Bank Database of Indigenous Knowledge and Practices in Sub-Saharan Africa: <http://www.worldbank.org/afr/ik/datab.htm>
- Traditional Chinese Medicine Patent Database http://chmp.cnipr.cn/tcm_patent1/englishversion/help/help.html

4.4 Servicios de Búsqueda

Las oficinas de patentes en general ofrecen servicios de búsqueda y copia de documentos de patentes

- Tales servicios generalmente tienen costos por cantidad y/o tiempo de búsqueda

Existen también varios prestatarios de servicios comerciales que ofrecen:

- Datos en línea con información sobre patentes
- Servicios de traducción de información de patentes
- Clasificaciones sistemáticas adicionales (p. ej. estructura y reacciones químicas o las secuencias biológicas)
- Servicios de búsqueda profesionales que pueden investigar sobre el estado anterior de la técnica
- Se puede consultar una amplia lista de prestatarios de servicios de patentes en: <http://www.piug.org/vendors.php>



Consulta a algunas bases electrónicas de datos de patentes

Colombia

Estados Unidos

Espacenet (Oficina Europea de Patentes)

Patent Scope

Derwent

Colombia: base de datos de patentes

Fecha de actualización:
Viernes 13 de Noviembre de 2009

ENGLISH | MAPA DEL SITIO | AYUDA | INICIO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

DOCTRINA | CIRCULAR ÚNICA | NORMATIVIDAD | COMPENDIOS | TRÁMITES | FORMATOS | TARIFAS Y PAGOS | SERVICIOS

CONOZCANOS

- Nuestra Entidad
- Marco Internacional
- Mecanismos de Control Institucional
- Atención al Usuario

PUBLICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA

- Artículos
- Conferencias
- Boletines

SERVICIOS EN LÍNEA BASES DE DATOS

- Propiedad Industrial**
- Protección al Consumidor
- Promoción de la Competencia
- Competencia Desleal
- Cámaras de Comercio
- Acreditación
- Metrología
- Notificaciones
- Petición de Información

NOTICIAS Y N

50 AÑOS DE LA LEY DE COMPETENCIA EN COLOMBIA

50 AÑOS LEY DE COMPETENCIA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN CONSUMIDOR

PROMOCIÓN COMPETENCIA

ACREDITACIÓN

METROLOGÍA

CAMARAS DE COMERCIO

Asesoría en línea

HORA LEGAL PARA COLOMBIA

DELATAR ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS, U 1340 DE 2009

Cómo sincronizar


Colombia: base de datos de patentes

Marcas
Lemas
Nombres
Enseñas
Denominación de Origen
CONOZCA LA DELEGATURA
Presentación
Funciones
Directorio
SERVICIOS
Información General
Información en Línea
Bases de Datos
Formatos
Enlaces
Trámites
Novedades
CONTÁCTENOS
Sugerencias
Quejas y Reclamos
Derecho de Petición
Nit.: 800176089-2 http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co
Horario de Atención al Público Lunes a Viernes

CONSULTA PATENTES


La Superintendencia de Industria y Comercio facilita en línea la consulta de patentes en Colombia y el mundo. El acceso a las bases de datos se ofrece en forma gratuita:

Base de datos en Colombia:

 **CONSULTA DE PATENTES PRESENTADAS EN COLOMBIA**

Base de datos de patentes de invención y modelos de utilidad presentados en Colombia, con el propósito de que el público en general pueda:

- Consultar el estado de sus solicitudes de patente así como el proceso y el avance de los mismos.
- Facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de documentos de patentes en Colombia.
- Realizar búsquedas con fin de evitar vulnerar invenciones protegidas, para determinar si en Colombia una invención (productos o procesos) se encuentra protegidas o identificar tecnologías de libre uso.

 **CONSULTA DE PATENTES PUBLICADAS EN COLOMBIA**

Base de datos de patentes de invención, patentes PCT y modelos de utilidad publicados en Colombia, permite realizar la búsqueda de Patentes Colombianas ingresando uno o varios de los siguientes criterios:

- Palabra(s) en el título o en el resumen de la patente.
- Número de patente.
- Autor y tipo de autor (Inventor, apoderado o solicitante) -Clasificación de la patente.
- Prioridad de la patente y el país de prioridad.
- Número de gaceta
- Número de expediente (año, número y contra de la radicación).

Colombia: base de datos de patentes

de 8.00 a las 10.30 horas
en jornada continua

Sede Centro:

Carrera 13 No. 27 - 00
Pisos Mezanine, 5 y 10
Bogotá - Colombia

Conmutador:

(57 1) 587 00 00

Fax: (57 1) 587 02 84

Call center: (571) 6513240

Línea gratuita nacional:

018000-910165

Sede CAN:

Avenida Carrera 50 No. 26 -
55 Int. 2
Bogotá - Colombia

Conmutador:

(57 1) 5737020 5735432

5735428 5736990

5735435 5737082

El resultado de la búsqueda es el listado de patentes colombianas que cumplen con el criterio de búsqueda, desde este listado se puede obtener la información detallada de la Patente.



**CONSULTA DE INVENCIONES
EN DOMINIO PÚBLICO**



La presente consulta permite dar a conocer las invenciones que pasan a ser de dominio público por que han caducado o por que su protección ha terminado de acuerdo con las normas actuales sobre la Propiedad Industrial en Colombia.

La información relacionada comprende todas las áreas de la tecnología entre los que se encuentran procedimientos y productos como son: productos farmacéuticos, químicos, cosméticos, agroquímicos, sanitarios, telecomunicaciones, entre otros.

Algunas bases de datos a nivel mundial:



Base de datos online gratuita que permite la búsqueda de patentes del mundo en más de 40 millones de documentos.



Base de datos online de la oficina española de patentes y marcas (OEPM) que da acceso a información de invenciones españolas



Bases de datos de USPTO

Bases de datos online gratuita en ingles que da acceso a información de patentes de USA.

Colombia: base de datos de patentes

Consulta de patentes presentadas en Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSULTA DE NUEVAS CREACIONES (patentes, modelos y diseños)..

Datos de la Creación

Número del expediente

▼

Número:

Ctrl:

Palabra(s) en el título

Empieza por

▼

(en mayúsculas)

Nombre de la persona natural o jurídica

Empieza por

▼

(en mayúsculas)

Tipo

▼

Número de Gaceta

Número de Certificado

prioridad de la patente

Pais

de

prioridad

▼

*

Consultar

Limpiar

Salir

Número de consultas atendidas :179649

Si desea que esta consulta mejore, por favor reporte sus comentarios a la **Oficina de Sistemas**

Colombia: base de datos de patentes

Consulta de patentes publicadas en Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSULTA DE PATENTES NACIONALES

Datos de la Patente

Buscar por: [palabra(s) en el título y/o resumen]

Número de Patente: -

Colección:

Nombre de la persona natural o jurídica: Tipo:

Clasificación de la patente:

Prioridad de la patente:

País de prioridad:

Datos del Expediente

Gaceta:

Número de Expediente: [año, núm y control de radicación]

COLOMBIA
 ESPAÑA
 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 EUROPEAN PATENT OFFICE(EPO)
 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION(WIPO)

Colombia: base de datos de patentes

Consulta de patentes patente en dominio publico en Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSULTA DE INVENCIONES EN DOMINIO PUBLICO

Datos de la Creación

Fecha del Desde Hasta

estado

Tramite Sector

Si desea que es

Númer

Reporte sus

stemas

Patentes

Patentes

Modelos

Diseños

PCT patente capitulo I y II

PCT modelo capitulo I y II

Todos

Todos

ABOGADOS

BIOTECNOLOGIA

INGENIERIA ELECTRICA

INGENIERIA MECANICA

INGENIERIA QUIMICA

QUIMICA FARMACEUTICA

QUIMICA PURA

SIN TEMA

Estados Unidos: bases de datos de patentes



United States Patent and Trademark Office

An Agency of the Department of Commerce

[Home](#) | [Help](#) | [Site Index](#) | [Contact Us](#)

SEARCH:

HOW DO I:

About USPTO Patents Trademarks IP Law & Policy Products & Services Careers Inventors News & Notices eBusiness/Alerts FAQs For Kids

Arti K. Rai Sworn-in as Administrator for External Affairs



Ms. Rai oversees the Office of Governmental Affairs and the Office of Intellectual Property Policy and Enforcement and serves as a policy advisor to USPTO Director David Kappos. She recently spoke at the 2009 Collegiate Inventors Competition (shown here).

» [Read more](#)

1 2 3 4 II

USPTO Self Service

Information Services and Data Products:

- Select a Product or Service -

Patents

- 1 **Patents Process**
Visit the Patent Basics page
- 2 **Search**
Search the Patent Full-Text and Image Database (PatFT)
- 3 **View Fee Schedule**
Check on the current fees and information related to the patent process
- 4 **File Online**
Apply for a patent using the Electronic Filing System (EFS-Web)


Trademarks

- 1 **Trademark Basics**
View Basic Information about Trademarks
- 2 **Search Marks**
Search pending and registered marks (TESS)
- 3 **File Forms Online**
File application and other documents online (TEAS)
- 4 **Check Status**
Check the status of an application or registration (TARR)
- 5 **View Documents**

Intellectual Property Law & Policy

- 1 **IP Policy and Enforcement**
USPTO leads efforts to develop and strengthen both domestic and international IP protection
- 2 **Training and Education**
The Global IP Academy (GIPA) offers IP related programs around the world
- 3 **Boards and Counsel**
General Counsel, Office of the Solicitor, Office of General Law, Office of Enrollment and Discipline, Board of Patent Appeals and Interferences, and Trademark Trial and Appeal

Estados Unidos: bases de datos de patentes

 **UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**
An Agency Of The United States Department Of Commerce

Patent Full-Text and Full-Page Image Databases

Recently, the databases have been frequently overloaded by some users or organizations heavily mining bulk data, in violation of our stated policy on bulk access restrictions. Please bear with us as we take steps to increase availability.

Important Notices and Policies -- Please Read!

PATFT: Issued Patents
Full-text since 1976; full-page images since 1790.

[Quick Search](#)
[Advanced Search](#)
[Patent Number Search](#)

[View Patent Full-Page Images](#)

[Status and Event History](#)
[Database Contents](#)
[Help Files](#)

[Report Data Errors](#)

[Report Problems](#)

How to Access and View Full-Page Images

AppFT: Patent Applications
Published since March, 2001.

[Quick Search](#)
[Advanced Search](#)
[Publication Number Search](#)

[View Publication Full-Page Images](#)

[Status and Event History](#)

[Help Files](#)

[Report Data Errors](#)

[Report Problems](#)

Estados Unidos: bases de datos de patentes

PATFT – Búsqueda básica

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)
[View Cart](#)

Data current through January 16, 2007.

Query [\[Help\]](#)

Term 1: in Field 1:

AND

Term 2: in Field 2:

Select years [\[Help\]](#)

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification
When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas

AND

AND

OR

ANDNOT

1976 to present [full-text]

1976 to present [full-text]

1790 to present [entire database]

All Fields

Title

Abstract

Issue Date

Patent Number

Application Date

Application Serial Number

Application Type

Assignee Name

Assignee City

Assignee State

Assignee Country

International Classification

Current US Classification

Primary Examiner

Assistant Examiner

Inventor Name

Inventor City

Inventor State

Inventor Country

Government Interest

Attorney or Agent

PCT Information

Foreign Priority

Reissue Data

Related US App. Data

Referenced By

Foreign References

Other References

Claim(s)

Estados Unidos: bases de datos de patentes

PATFT – Búsqueda avanzada

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

[View Cart](#)

Data current through January 16, 2007.

Query [\[Help\]](#)

Select Years [\[Help\]](#)

1976 to present [full-text] ▼

Examples:
ttl/(tennis and (racquet or racket))
isd/1/8/2002 and motorcycle
in/newmar-julie

←

Search

Redefinir

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification.
When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APN	Application Serial Number	ACN	Assignee Country
APD	Application Date	EXP	Primary Examiner
PARN	Parent Case Information	EXA	Assistant Examiner
RLAP	Related US App. Data	REF	Referenced By

Estados Unidos: bases de datos de patentes

PATFT – Búsqueda por número

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#)[Quick](#)[Advanced](#)[Pat Num](#)[Help](#)[View Cart](#)

Data current through January 16, 2007.

Enter the patent numbers you are searching for in the box below.

Query [\[Help\]](#)

All patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional. Examples:

Utility -- 5,146,634 6923014 0000001

Design -- D339,456 D321987 D000152

Plant -- PP08,901 PP07514 PP00003

Reissue -- RE35,312 RE12345 RE00007

Defensive Publication -- T109,201 T855019 T100001

Statutory Invention Registration -- H001,523 H001234 H000001

Re-examination -- RX29,194 RE29183 RE00125

Additional Improvement -- AI00,002 AI000318 AI00007

Estados Unidos: bases de datos de patentes

AppFT – Búsqueda básica

US PATENT & TRADEMARK OFFICE
PATENT APPLICATION FULL TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#) [Home](#) [Boolean](#) [Manual](#) [Number](#) [PTDLs](#)
[View Shopping Cart](#)

Data current through November 12, 2009.

Query [\[Help\]](#)

Term 1: in Field 1: All Fields ▼

AND ▼

Term 2: in Field 2: All Fields ▼

Select years [\[Help\]](#) 2001-present ▼

All Fields

Title

Abstract

Publication Date

Document Number

Application Date

Application Serial Number

Assignee Name

Assignee City

Assignee State

Assignee Country

Current US Classification

International Classification

Inventor Name

Inventor City

Inventor State

Inventor Country

Government Interest

PCT Information

Foreign Priority

Related US App. Data

Claim(s)

Publication Document Kind Code(s)

Publication Filing Type(s)

Description/Specification

Estados Unidos: bases de datos de patentes

AppFT – Búsqueda avanzada

US PATENT & TRADEMARK OFFICE PATENT APPLICATION FULL TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#) [Home](#) [Boolean](#) [Manual](#) [Number](#) [PTDLs](#)

[View Shopping Cart](#)

Data current through November 12, 2009.

Query [\[Help\]](#)

Example: ttl/needle or ttl/syringe andnot (sew or thread\$)

Select Years [\[Help\]](#) 2001-present ▼

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
DN	Document Number	IN	Inventor Name
PD	Publication Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	GOVT	Government Interest
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APT	Application Type	ACN	Assignee Country
APN	Application Serial Number	KD	Pre-Grant Publication Document Kind Code
APD	Application Date	RLAP	Related US App. Data
PRIR	Foreign Priority	PCT	PCT Information

Estados Unidos: bases de datos de patentes

AppFT – Búsqueda por numero

US PATENT & TRADEMARK OFFICE
PATENT APPLICATION FULL TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#) [Home](#) [Boolean](#) [Manual](#) [Number](#) [PTDLs](#)
[View Shopping Cart](#)

Data current through November 12, 2009.

Enter the published application or document number(s) you're searching for in the box below.

Query [\[Help\]](#)

Example:
Utility : 20010000044

Estados Unidos: bases de datos de patentes

The screenshot displays the esp@cenet website, which is a platform for patent searches. The header features logos for OMPI, EPO, and OEPM, along with a row of flags representing participating countries. The main navigation bar includes links for 'Inicio | Contacto', language options ('Español', 'Português', 'Inglés'), and an 'Índice de ayuda'.

Búsqueda rápida
Buscar con palabras clave o por personas u organizaciones

Búsqueda avanzada
Buscar utilizando cualquiera de los campos disponibles

Búsqueda por número
Buscar utilizando número de prioridad, solicitud o publicación

Sistemas de clasificación
Información y recursos sobre la Clasificación Internacional de Patentes y la ECLA.

Latipat - esp@cenet

Búsqueda experta:

Ejemplo: Multibras MX 2006 refrigeracion

- [Explicación](#)

En el año 2003 la OMPI, la EPO, la OEPM y numerosas oficinas nacionales de países latinoamericanos asumieron el reto de poner a disposición del público un importante acervo de información tecnológica en español y portugués, contenida en los documentos de patentes publicadas por todas ellas. Este programa fue denominado LATIPAT y utiliza la plataforma de esp@cenet ®.

Los países y organizaciones participantes acordaron que la mejor forma de contribuir al desarrollo tecnológico e institucional en Latinoamérica consistía en la difusión de la información de patentes en español y portugués que describe tecnología que en su mayor parte es ya de dominio público.

Fruto del esfuerzo y del compromiso de las oficinas nacionales participantes y del apoyo e impulso de la OMPI, la EPO y la OEPM se ha logrado consolidar una base de datos de referencia en el mundo.

Actualmente la base de datos contiene más de un millón y medio de datos bibliográficos y varios miles de imágenes.

- [Responsables del Programa de cada país](#)

Noticias de última hora

Nueva versión Eptos 7 en Latipat.
Nueva versión Eptos 7 para nuestra página web.
-Nueva opción de "Búsqueda experta".
-Marcadores en las palabras de búsqueda.
■ [leer más...](#)

Newsflash
Anuncio sobre datos de situación jurídica de Polonia
[Leer más](#)
■ [leer más...](#)

Últimas actualizaciones

- **WO2009137847** - 20091112
- **EP2117288** - 20091111

■ [leer más...](#)

Cobertura local:

- **ES2328553 (A1)** - 20091113

Espacenet: bases de datos de patentes

Búsqueda rápida

Búsqueda avanzada

Búsqueda por número

Última lista de resultados

Mi lista de patentes 0

Sistemas de clasificación

Ayuda

Ayuda rápida

- » ¿Por qué hay sólo 2 bases de datos disponibles?
- » ¿Cuántos términos puedo introducir por campo?
- » ¿Puedo buscar una combinación de palabras?
- » ¿Cómo introduzco el nombre de una organización/empresa?
- » ¿Usa una búsqueda el nombre de una organización/persona sólo relacionado con el nombre del solicitante?

Búsqueda rápida

1. Seleccionar base de datos

Seleccionar la base de datos en la que desea buscar:

Seleccionar base de datos de patentes:

Worldwide

Worldwide
LP - esp@cenet
Worldwide
EP - esp@cenet
WIPO - esp@cenet
FR - esp@cenet
NL - esp@cenet
HR - esp@cenet
SK - esp@cenet
PL - esp@cenet
IS - esp@cenet
ES - esp@cenet
LU - esp@cenet
AT - esp@cenet

2. Seleccionar tipo de búsqueda

Seleccionar si desea buscar con palabras simples en los títulos y resúmenes (donde sea posible) o con el nombre de un individuo u organización:

Seleccionar qué buscar:

- ☒ Palabras en el título o resumen
- ☐ Personas u organizaciones

3. Introducir términos de búsqueda

Introducir términos de búsqueda en inglés en mayúsculas o minúsculas indistintamente

Término(s) de búsqueda:

plastic and bicycle

BUSCAR

BORRAR

Espacenet: bases de datos de patentes

Búsqueda rápida

Búsqueda avanzada

Búsqueda por número

Última lista de resultados

Mi lista de patentes 0

Sistemas de clasificación

Ayuda

Ayuda rápida

» ¿Por qué hay sólo dos bases de datos disponibles?

» ¿Cuántos términos puedo introducir por campo?

» ¿Puedo buscar una combinación de palabras?

» ¿Puedo usar truncamientos?

» ¿Qué es un número de publicación, un número de solicitud y un número de prioridad?

» ¿Cómo puedo introducir un número de publicación, de solicitud o de prioridad?

» ¿Cuál de la diferencia entre IPC y ECLA?

» ¿Puedo introducir un

Búsqueda avanzada

1. Seleccionar base de datos

Seleccionar la base de datos en la que desea buscar:

Seleccionar base de datos de patentes: Worldwide

Worldwide

LP - esp@cenet

Worldwide

EP - esp@cenet

WIPO - esp@cenet

FR - esp@cenet

NL - esp@cenet

HR - esp@cenet

SK - esp@cenet

PL - esp@cenet

IS - esp@cenet

ES - esp@cenet

LU - esp@cenet

AT - esp@cenet

2. Introducir términos de búsqueda

Introducir palabras clave en español, portgues y/o inglés

Palabra(s) clave en título:		plastic and bicycle
Palabra(s) clave en título o resumen:		hair
Número de publicación:		WO2008014520
Número de solicitud:		DE19971031696
Número de prioridad:		WO1995US15925
Fecha de publicación:		yyyymmdd
Solicitante(s):		Institut Pasteur
Inventor(es):		Smith
Clasificación europea (ECLA)		F03G7/10
Clasificación Internacional de Patentes(IPC)		H03M1/12

BUSCAR

BORRAR

Espacenet: bases de datos de patentes

The screenshot displays the Espacenet website interface. At the top, there are logos for OMPI, European Patent Office, and the Espacenet logo with the years 1998-2008. Below these are flags of various countries and language options: Español, Português, and Inglés. A navigation bar includes links for Inicio | Contacto and an Índice de ayuda with a question mark icon.

On the left side, a sidebar contains several menu items: Búsqueda rápida, Búsqueda avanzada, Búsqueda por número (highlighted with a red box), Última lista de resultados, Mi lista de patentes (showing 0 items), Sistemas de clasificación, and Ayuda. Under the Ayuda section, there is a sub-section titled Ayuda rápida with two questions: « ¿Qué contiene cada base de datos? » and « ¿Cuál es la publicación, la aplicación, la prioridad y números de referencia NPL? ».

The main content area is titled Búsqueda por número. It contains two steps:

- 1. Seleccionar base de datos**
Seleccionar la base de datos en la que desea buscar:
Seleccionar base de datos de patentes: Worldwide (highlighted with a red box). A dropdown menu is open, showing a list of options: Worldwide, LP - esp@cenet, Worldwide (highlighted in blue), EP - esp@cenet, WIPO - esp@cenet, FR - esp@cenet, NL - esp@cenet, HR - esp@cenet, SK - esp@cenet, PL - esp@cenet, IS - esp@cenet, ES - esp@cenet, LU - esp@cenet, and AT - esp@cenet. A red arrow points from the dropdown menu to the Worldwide option in the selection box.
- 2. Introducir número de publicación**
Introducir número de publicación con prefijo de código de país
A text input field is shown with the value WO2008014520.

At the bottom, there are two buttons: BUSCAR and BORRAR.

PatentScope: Base de patentes de OMPI



Esta función le permite efectuar la búsqueda entre 1.653.149 solicitudes internacionales de patente y consultar la [información y los documentos](#) más recientes que estén disponibles en la Oficina Internacional.

Búsqueda sencilla

opciones ▾

resultados ▾

» **Busqueda:**

en los datos bibliograficos de la pagina de portada

» **Los resultados deben contener:**

Búsqueda

☒ Cronológica
☐ Por relevancia

Clasificación
Longitud de lista
☐ Ventana independiente
Presentación

☒ 25
☐ 50
☐ 100
☐ 250
☐ 500

☒ Número de pub.
☒ Título
☒ Fecha de pub.
☒ Clasificación Int.
☒ Número sol.
☐ Primer inventor
☒ Primer solicitante
☒ Resumen
☐ Imagen

PatentScope: Base de patentes de OMPI



Esta función le permite efectuar la búsqueda entre 1.653.149 solicitudes internacionales de patente y consultar la [información y los documentos](#) más recientes que estén disponibles en la Oficina Internacional.

Búsqueda avanzada

opciones ▾

resultados ▾

» **Fecha** ☒ Todo ☐ Semana del: 12/11/2009

» **Buscar en:** ☒ la página de portada ☐ Texto íntegro

Ejemplo: et/needle or et/syringe andnot (sew* or thread) or WO/2005/012345 or PCT/US2004/012345

Búsqueda

- ☒ Cronológica
- ☐ Por relevancia

- Clasificación
- Longitud de lista
- ☐ Ventana independiente
- Presentación

- ☒ 25
- ☐ 50
- ☐ 100
- ☐ 250
- ☐ 500

- ☒ Número de pub.
- ☒ Título
- ☒ Fecha de pub.
- ☒ Clasificación Int.
- ☒ Número sol.
- ☐ Primer inventor
- ☒ Primer solicitante
- ☒ Resumen
- ☐ Imagen

PatentScope: Base de patentes de OMPI



Esta función le permite efectuar la búsqueda entre 1.653.149 solicitudes internacionales de patente y consultar la [información y los documentos](#) más recientes que estén disponibles en la Oficina Internacional.

Búsqueda estructurada

opciones resultados

» Palabras clave Página de portada

AND	<input type="text"/>	Número de publicación	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Número de la solicitud	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Fecha de publicación	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Título en inglés	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Resumen en inglés	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Nombre del solicitante	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Clasificación Int.	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Nombre del inventor	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	País de la fase nacional	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Descripción	<input type="text"/>
AND	<input type="text"/>	Reivindicaciones	<input type="text"/>

Número de publicación
Número de la solicitud
Fecha de publicación
Fecha de solicitud
Título en inglés
Título en francés
Título en japonés
Resumen en inglés
Resumen en francés
Resumen en japonés
Nombre del solicitante
Dirección del solicitante
Domicilio del solicitante
Nacionalidad del solicitante
Nombre del rep. legal
Dirección del rep. legal
Clasificación Int.
Nombre del inventor
Dirección del inventor
País de la fase nacional
Fecha de entrada en la fase na
N° de solicitud en fase naciona
Tipo de entrada en la fase naci
Número de prioridad
Fecha de prioridad
País de prioridad
Estados designados
Idioma de presentación
Idioma de publicación
Reivindicaciones

Búsqueda

PatentScope: Base de patentes de OMPI



PATENTSCOPE
Búsqueda en solicitudes internacionales de patente

Esta función le permite efectuar la búsqueda entre 1.653.149 solicitudes internacionales de patente y consultar la [información y los documentos](#) más recientes que estén disponibles en la Oficina Internacional.

Búsqueda por semana

opciones ▾

Semana de publicación ◀

46/2009 (12.11.2009) ▾

[Notificaciones oficiales \(Sección IV\)](#)

[Archivos de la Gaceta del PCT](#)

[1-200 / 3490]


Página

1 ▾ ▶

<u>Número de pub.</u>	<u>Título</u>		
<u>Tipo</u> ▲	<u>No de solíc.</u>	<u>CIP</u>	<u>Solicitante</u>
1. (WO/2009/135230) CLAMSHELL HANDLE WITH MANIPULATABLE COVER PLATE			
Initial Publication with ISR [A1]	AT2009/000091	E05B 5/00 (2006.01)	SIKORA, Günter
2. (WO/2009/135231) DISPENSER FOR SOAP			
Initial Publication with ISR [A1]	AT2009/000114	A47K 5/12 (2006.01)	HAGLEITNER, Hans Georg
3. (WO/2009/135232) PAPER DISPENSER			
Initial Publication with ISR [A1]	AT2009/000138	A47K 10/36 (2006.01)	HAGLEITNER, Hans, Georg
4. (WO/2009/135233) DISPENSER FOR A FLOWABLE MEDIUM			
Initial Publication without ISR [A2]	AT2009/000139	none	HAGLEITNER, Hans, Georg

Derwent: Base de patentes comercial

[Sign In](#) | [My EndNote Web](#) | [My ResearcherID](#) | [My Citation Alerts](#) | [My Saved Searches](#) | [Log Out](#) | [Help](#)

ISI Web of KnowledgeSM *Take the next step* 

[All Databases](#) | [Select a Database](#) | [Web of Science](#) | [Additional Resources](#)

Use the "All Databases" tab above to search all databases, or select a single database from the list below.

Web of Science® (1945-present)
Access the world's leading scholarly literature in the sciences, social sciences, arts, and humanities and examine proceedings of international conferences, symposia, seminars, colloquia, workshops, and conventions.
[\[more \]](#)


Journal Citation Reports® (2007-2008)
Journal performance metrics offer a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals
[\[more \]](#)


Derwent Innovations IndexSM (1963-present)
Value-added patent information from *Derwent World Patent Index®* as well as patent citation information from *Patents Citation Index®*.
[\[more \]](#)

View in [简体中文](#) | [English](#)

Please give us your [feedback](#) on using ISI Web of Knowledge.

[Acceptable Use Policy](#)
Copyright © 2009 Thomson Reuters

 **THOMSON REUTERS**
Published by Thomson Reuters


CAPES

Why select only one database?
Target your search
Each database within *ISI Web of Knowledge* has unique content and capabilities, including specialized search fields and controlled vocabularies.

Other Tools
Scientific WebPlus
Find scientifically relevant Web content fast! Search the open Web and quickly see the most relevant content for the topics you care about, with *Scientific WebPlus*.

Derwent: Base de patentes comercial

[All Databases](#) [Select a Database](#) [Derwent Innovations Index](#) [Additional Resources](#)

[Search](#) [Cited Patent Search](#) [Advanced Search](#) [Search History](#) [Marked List \(0\)](#)

Derwent Innovations IndexSM

Search for:

Example: recharg lithium batter**

in

Topic

AND
Example: Von Oepen R or Oepen R V

in

Inventor

AND
Example: EP797246 or US5723945-A

in

Patent Number

[Add Another Field >>](#)

Search

Clear

Current Limits: [\[Hide Limits and Settings\]](#) (To save these permanently, [sign in](#) or [register](#).)

Timespan:

☒ All Years (updated 2009-11-16)

☐ From

1963-66

 to

2009

 (default is all years)

Citation Databases:

☒ Chemical Section--1963-present

☒ Electrical and Electronic Section--1963-present

☒ Engineering Section--1963-present

Derwent: Base de patentes comercial

All Databases

Select a Database

Derwent Innovations Index

Additional Resources

Search

Cited Patent Search

Advanced Search

Search History

Marked List (0)

Derwent Innovations IndexSM

Cited Patent Search. Find the patents that cite a patent or patents

[View our Cited Patent Search tutorial.](#)

Enter the patent number, assignee, inventor, and/or accession number.

Cited Patent Number:

EP797246

☐ Expand Search to include all patent numbers in the found patent family
Example: EP797246 or US5723945-A



Cited Assignee:

☒ Name and Code ☐ Name Only ☐ Code Only
Example: XEROX CORP or XERO

Cited Inventor:

Example: Von Oepen R

Cited Derwent Primary Accession Number:

Example:  1998-321575 

Search

Clear

Current Limits: [\[Hide Limits and Settings\]](#) (To save these permanently, [sign in](#) or [register](#).)

Timespan:

☒ All Years

▼

 (updated May 24, 2008)

☐ From 1963-66

▼

 to 2008

▼

 (default is all years)

Citation Databases:

☒ Chemical Section--1963-present

☒ Electrical and Electronic Section--1963-present

☒ Engineering Section--1963-present

Derwent: Base de patentes comercial

All Databases

Select a Database

Derwent Innovations Index

Additional Resources

Search

Cited Patent Search

Advanced Search

Search History

Marked List (0)

Derwent Innovations IndexSM

Advanced Search. Use 2-character tags, Boolean operators, parentheses, and set references to create your query. Results appear in the Search History at the bottom of the page.

Example: TS=(nanotub* SAME carbon) NOT AU=Smalley RE
#1 NOT #2 [more examples](#) | [view the tutorial](#)

Search

Current Limits: [\[Hide Limits and Settings\]](#) (To save these permanently, [sign in](#) or [register](#).)

Timespan:

☒ All Years

(updated 2009-11-16)

☐ From

1963-66

to

2009

(default is all years)

Citation Databases:

☒ Chemical Section--1963-present

☒ Electrical and Electronic Section--1963-present

☒ Engineering Section--1963-present

Booleans: AND, OR, NOT, SAME

Field Tags:

TS=Topic

TI=Title

AU=Inventor

PN=Patent Number

IP=IPC Code

DC=Class Code

MC=Manual Code

GA=PAN

AN=Assignee Name

AC=Assignee Code

AE=Assignee Name + Code

CP=Cited Patent Number

CX=CP + Family

CA=Cited Assignee

CN=Cited Assignee Name

CC=Cited Assignee Code

CI=Cited Inventor

CD=Cited PAN

